

## 4단자 방법에 의한 금속 비저항의 정밀측정에 관한 연구

강전홍, 김한준, 유광민, 한상옥\*, 박강식\*\*, 이세현\*\*\*

한국표준과학연구원, 충남대학교\*, 대덕대학교\*\*, 한국폴리텍대학교\*\*\*

### A Study on the Precision Measurement of Metallic Resistivity by Four Terminal Method

Jeon Hong Kang, Han Jun Kim, Kwang Min Yu, Sang Ok Han\*, Kang Sic Park\*\*, Sei Hyun Lee\*\*\*

KRISS, Chungnam National Univ., Deaduk College\*\*, Korea Polytechnic Colleges\*\*\*

**Abstract :** 금속 비저항의 측정방법은 4단자 방법을 비롯한 van der Pauw 방법, Four-Point Probe(FPP) 방법, eddy current 방법 등이 사용되고 있으며, 시료의 형상과 크기에 따라서 그 측정방법은 각각 다르다. 본 연구에서는 그 중 4단자 방법에 의한 정밀측정방법과 측정불확도 평가에 관하여 고찰하였다. 4단자 방법은 시료가 바(bar)나 봉(rod) 형상이면 측정이 가능하며, 시료의 정밀가공과 측정기술을 통하여 측정 불확도를 줄일 수 있다.

**Key Words :** Electrical Resistivity, Conductivity, 4 Terminal Method, %IACS, Conductance

### 1. 서 론

자성 또는 비자성 금속은 사용 목적과 용도에 따라서 전기 비저항에 대한 정밀한 측정이 요구되기도 한다. 금속 재료 중 가장 전기 전도도가 좋은 은(Ag)을 비롯하여 구리(Cu), 알루미늄(Al) 등 순수한 금속뿐만 아니라 여러 합금 재료들이 널리 사용되고 있으며, 전기 비저항은 대부분 DC(Direct Current)를 이용하여 ASTM 또는 KS M 시험규격에 따른다. 바(bar)나 봉(rod) 형상의 금속재료의 비저항을 시험하고자 할 때 시험에 적합한 전극구성장치가 없어 정밀측정에 많은 어려움을 겪기도 하며, 사용기기 및 시료의 상태와 측정기술에 따라서 시험결과는 동일한 시료라 하더라도 측정자마다 다르게 나타날 수 있다. 따라서 본 연구는 4단자 방법에 의한 금속 전기 비저항의 정밀측정기술에 관하여 고찰하였다.

### 2. 실 험

#### 2.1 실험준비

금속 비저항에 대한 정밀한 측정을 위하여 본 연구는 ASTM B193-02규격에 따라 그림 1처럼 측정 시스템을 구성하였으며, 사용된 기기는 직류 전류원(FLUKE 5720A, 5725A, 전류 불확도: 50  $\mu$ A/A), 직류 전압계(WAVETEK 1281, Agilent 3458A, 불확도: 10  $\mu$ V/V), 표준저항(L&N 10 m $\Omega$ , 불확도: 3  $\mu$  $\Omega$ / $\Omega$ )이다. 이들은 모두 국가표준의 소급성으로부터 교정된 기기이며, 측정 시스템에서 직렬로 연결된 표준저항은 시료에 공급되는 전류를 정확하게 알기

위하여 사용된다. 시료는 비자성 금속인 스테인레스 스틸(SUS-316)을 선정하여 길이 400 mm, 폭 30 mm, 두께 10 mm의 바(bar)형상으로 가공하였으며, 4단자 방법으로 측정이 용이한 전극 구성장치를 제작하여 실험에 사용하였다. 이 전극 구성장치는 시료의 길이가 500 mm 이하이면 바(bar)나 봉(rod)형상 모두 쉽게 사용할 수 있도록 설계되었으며, 전극 C와 D에서의 전위차(V)를 정확하게 측정하기 위하여 knife edge 전극(electrode)으로 제작하였고, 필요에 따라 전위차 측정 전극의 간격( $L$ )을 좌, 우로 동시에 조절되도록 하였다. 또한 knife edge 전극이 시료의 표면에 수직방향으로 접촉되도록 설계하여 C와 D의 간격( $L$ )에 따른 전위차( $V$ )를 정확하게 측정할 수 있도록 하였으며, 전극 간격에 따라 평균 전위차를 쉽게 측정할 수 있는 장점도 있다.

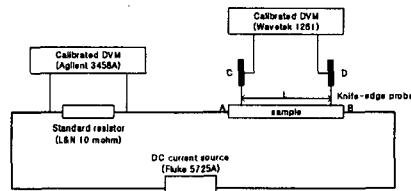


그림 1. 측정 시스템

#### 2.2 실험내용

금속의 전기 비저항 시험은 %IACS (% International Annealed Copper Standard)의 정의에 따라 20 °C에서 실시하도록 규정되어 있으므로 본 연구는 온도 (20 ± 1) °C, 습도 50 % 이하로 유지되는 실험환경조건에서 측정하였다. 실험은 전류원으로부터 직류전류 10 A를 그림 1

의 A에서 B방향으로 공급하고, 전극 C와 D에서 전위차 ( $V$ )를 측정하여 저항( $R$ )을 구하였다. 비저항( $\rho$ )은 아래의 식 (1)에서처럼 단위면적( $A$ )에서의 시료두께와 비례하는 관계가 있으므로 가능한 정확하게 측정하여야 측정 불확도를 줄일 수 있다. 그러나 버니어 켈리퍼스나 마이크로미터 등으로 시료의 형상에 따라 두께를 정확하게 측정하는 것은 쉬운 일이 아니다. 따라서 이들보다 사용이 간편하고 두께를 정확하게 측정할 수 있는 두께 측정 장치를 그림 2처럼 제작하였다. 제작된 두께 측정기는 digital micrometer의 probe를 서로 마주보게 하여 시료의 두께를 측정하는 원리를 적용하였다. 두께 측정은 시료의 전체 면에 대하여 약 10 mm 간격으로 측정하여 평균하였으며, 교정된 digital micrometer를 사용하였다. 전류원과 전압계는 정확한 측정을 위하여 제작사에서 권하는 예열 시간을 준수한 후 측정하였다. 그리고 offset에 의한 오차를 최대한 줄이기 위하여 전류를 정방향과 역방향으로 흘려 각각의 전위차를 측정하고, 평균값을 취하여 오용의 법칙( $R = \frac{V}{I}$ )에 의해 저항( $R$ )을 계산하였다. 여기서  $N$  전위차,  $I$ : 시료에 흘려준 전류이다. 또한, 측정은 10분 간격으로 6회 측정하여 평균값과 표준편차를 구하였으며, 그 측정 결과로부터 전기비저항은 다음 식 (1)에 의하여 계산된다.

$$\rho = \frac{RA}{L} (\mu\Omega \cdot \text{cm}) \quad (1)$$

여기서,  $\rho$ : 시료의 비저항( $\mu\Omega \cdot \text{cm}$ ),  $R$ : 측정저항( $\Omega$ ),  $A$ : 시료의 단면적( $\text{cm}^2$ ),  $L$ : 측정 전극 C와 D간의 간격( $\text{mm}$ )이며, 전기 전도도( $\sigma$ )는 식 (2)로서 구해진다.

$$\sigma = \frac{1}{\rho} (\text{MS}/\text{cm}) \quad (2)$$

그리고, 전기 전도도( $\sigma$ )를 백분율 단위인 %IACS로 나타낼 경우에는 순수한 구리 (Pure-Copper)가 100 % 일 때, %IACS 단위는 다음 식 (3)으로 계산된다. 여기에서 적용되는 순수한 구리(Pure-Copper)의 비저항( $\rho$ )은 20 °C에서 1.7241  $\mu\Omega \cdot \text{cm}$  이다[1].

$$\%IACS = \left( \frac{1}{\rho} \right) \times 1.7241 \mu\Omega \cdot \text{cm} \quad (3)$$

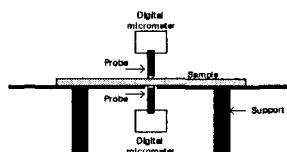


그림 2. 두께 측정 장치

### 3. 결과 및 고찰

식 (1)(2)(3)으로부터 비저항, 전도도, 도전율이 계산된 결과는 표 1과 같으며, 측정 불확도 분석 내용은 표 2와 같다. 측정 불확도는 측정량에 영향을 미치는 사용된 모든 기기에 대하여 표준 불확도를 구하고, 합성 표준불확도를 취하여 확장 불확도를 계산하게 된다[2]. 시료의 두께가 측정 불확도에 큰 영향을 미치므로 시료를 정밀 가공하여야 하며, 두께 측정은 가능한 시료의 전체 면에서 측정하여 평균값을 취하는 것이 정밀 측정에 유리하다. 또한 정밀 측정을 위해서는 ASTM과 KS M 규격에 의한 전극구성장치가 필요하다.

표 1. 측정결과

$A (\text{mm}^2)$	$L (\text{mm})$	$R (\mu\Omega)$
330.5	240.4	551.7
Resistivity( $\rho$ ) ( $\mu\Omega \cdot \text{cm}$ )	Conductivity( $\sigma$ ) ( $\text{MS}/\text{cm}$ )	Conductivity ratio (%IACS)
75.86	0.013 18	2.273

표 2. 측정불확도 분석

불확도 요인	표준 불확도( $k=1$ )	합성 표준불확도	확장 불확도( $k=2$ )
면적( $A$ )	0.07 %		
간격( $L$ )	0.08 %		
전압계( $V$ )	0.05 %	0.125 %	0.25 %
전류원( $I$ )	0.005 %		

### 4. 결론

- 금속 비저항의 정밀측정을 위해서는 전극 구성장치, 안정된 전류원, 정확도가 높은 전압계, 교정된 디지털 마이크로 미터 등이 필요한 것으로 나타났다.
- 기존 측정 불확도는 약 1.0 %였으나 본 연구에서는 0.25 %로서 측정 불확도가 크게 향상되었다.

### 참고 문헌

- [1] ASTM B 193-78, Resistivity of electrical conductor materials (1978).
- [2] European cooperation for Accreditation, "Expression of the Uncertainty of Measurement in Calibration", Publication Reference EA-4/02, December, 1999.